

## 信頼性試験結果

製品名 : S-8358HxxBD-xxxTx  
搭載パッケージ : 6-Pin SNB(B)

No.	試験名	試験条件	時間	r/n	故障判定基準
1	高温動作	Ta=125 °C V <sub>OUT</sub> = V <sub>OUT(s)</sub> ×0.6	1000 h	0/22	製品規格を満足すること
2	高温バイアス	Ta=125 °C V <sub>OUT</sub> = V <sub>abs max.</sub> ×0.9	1000 h	0/22	製品規格を満足すること
3	#1 高温高湿バイアス	Ta=85 °C RH=85 % V <sub>OUT</sub> = V <sub>abs max.</sub> ×0.9	1000 h	0/22	製品規格を満足すること
4	#1 プレッシュャ クック・バイアス	Ta=125 °C RH=85 % P=2×10 <sup>5</sup> Pa V <sub>OUT</sub> = V <sub>abs max.</sub> ×0.9	100 h	0/22	製品規格を満足すること
5	高温保存	Tstg max.=150 °C	1000 h	0/22	製品規格を満足すること
6	低温保存	Tstg min.=-65 °C	1000 h	0/22	製品規格を満足すること
7	#1 温度サイクル (気相)	Tstg max.=150 °C , Tstg min.=-65 °C 各 30 分	200 cycles	0/22	製品規格を満足すること
8	#1 熱衝撃 (液相)	Tstg max.=150 °C , Tstg min.=-65 °C 各 5 分	100 cycles	0/22	製品規格を満足すること
9	はんだ耐熱性 1 (リフロー)	T=260 °C 10s	3 回	0/22	製品規格を満足すること 外観上、異常がなきこと
10	はんだ接合強度 (せん断強度)	Tstg max.=125 °C , Tstg min.=-40 °C 各 30 分 はんだ材 : Sn-3.0Ag-0.5Cu	2000 cycles	0/5	初期強度値の 50%以上の 強度を維持すること
11	静電耐圧 1	V=±2000 V C=100 pF R=1.5 kΩ V <sub>OUT</sub> 基準 V <sub>ss</sub> 基準 ±印加 各 5 個	5 回	0/5 合計 20 個	製品規格を満足すること
12	静電耐圧 2	V=±200V C=200 pF R=0 Ω V <sub>OUT</sub> 基準 V <sub>ss</sub> 基準 ±印加 各 5 個	3 回	0/5 合計 20 個	製品規格を満足すること
13	ラッチアップ強度	±100 mA (クランプ電圧 V <sub>opr max.</sub> ) 10 msパルス V <sub>OUT</sub> = V <sub>opr max.</sub>	1 回	0/5	ラッチアップしないこと

注)V<sub>abs max.</sub>=絶対最大定格 V<sub>opr max.</sub>=最大動作電圧 V<sub>opr min.</sub>=最低動作電圧  
#1 : 前処理を実施後、シリーズに試験を実施する。

前 処 理 (#1)		
高温放置	吸湿処理	熱 処 理
Ta=125 °C t=24 h	Ta=85 °C RH=85 % t=168 h	赤外線リフロー3 回 T=260 °C t=10 s